

薄膜光学

纤锌矿GaN薄膜光学性质的研究

李雪, 魏彦峰, 龚海梅, 方家熊

(中国科学院上海技术物理所 传感技术国家重点实验室, 上海 200083)

收稿日期 2005-10-19 修回日期 2005-12-12 网络版发布日期 2007-2-9 接受日期

摘要 在测试大量纤锌矿GaN外延薄膜透射光谱基础上, 通过对有代表性的四个样品的透射光谱进行拟合, 获取了GaN外延薄膜的光学常量并计算了薄膜厚度. 结果表明: GaN外延薄膜的折射率差异较小, 但在370~800 nm波长范围内消光系数差异很大, GaN薄膜的消光系数差异在一定程度上可用于评价外延薄膜的质量.

关键词 [GaN](#) [透射光谱](#) [折射率](#) [消光系数](#)

分类号 [TN304.2](#)

通讯作者 李雪 lixue@mail.sitp.ac.cn

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(534KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“GaN”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [李雪](#)
- [魏彦峰](#)
- [龚海梅](#)
- [方家熊](#)